

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Programma Operativo 2014-2020**

**Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**

**- FESR -**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI**

**LOTTO 2: SISTEMA FIB-SEM (Focused Ion Beam – Scanning Electron Microscope)**

Il presente documento riassume le specifiche dell’apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle.

(riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell’Offerente)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rif. requisito in Capitolato | Rispondenza | Riferimenti a paragrafi relazione tecnica | Eventuali note dell’Offerente |
| Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema | | | |
| 2.1.1 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.1 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.2 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.3 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.4 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.5 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.6 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.7 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.8 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.9 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.10 | □ SI |  |  |
| Caratteristiche tecniche e funzionali minime dei componenti | | | |
| Colonna Ionica – Focused Ion Beam (FIB) | | | |
| 2.2.1.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.5 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.6 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.7 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.8 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.9 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.10 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.11 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.12 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.13 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.14 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.15 | □ SI |  |  |
| Colonna Elettronica – Scanning Electron Microscope (SEM) | | | |
| 2.2.2.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.5 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.6 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.7 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.8 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.9 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.10 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.11 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.12 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.13 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.14 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.15 | □ SI |  |  |
| Camera di analisi e sistema di movimentazione | | | |
| 2.2.3.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.3.a | □ SI |  |  |
| 2.2.3.3.b | □ SI |  |  |
| 2.2.3.3.c | □ SI |  |  |
| 2.2.3.3.d | □ SI |  |  |
| 2.2.3.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.5 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.6 | □ SI |  |  |
| Sistema di introduzione di gas precursori – Gas Injection System (GIS) | | | |
| 2.2.4.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.5 | □ SI |  |  |
| Sistema di produzione e controllo del vuoto in camera | | | |
| 2.2.5.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.5 | □ SI |  |  |
| Sistema di controllo di apparecchiatura e processo | | | |
| 2.2.6.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.6.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.a | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.b | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.c | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.d | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.e | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.f | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.g | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.h | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.i | □ SI |  |  |
| 2.2.6.3.j | □ SI |  |  |
| 2.2.6.4 | □ SI |  |  |